

FT 工程 歩留管理グラフ

FT Process YLD control graph

管理機種 / PKG名 (Device name/ PKG name)

工程名(Flow)

AUTO-

BOX FTB No.

班長 (GL)

[illegible]

4	Time	1st.	2nd.	3rd.	Wafer No.																																								
歴 歴 ประวัติ	3回前 ก่อนหน้า 3 ครั้ง	前々回 ก่อนหน้า 2 ครั้ง	前回 ก่อนหน้า 1 ครั้ง																																										
月/日 M/D																																													
UCL																																													
AVE																																													
LCL																																													

Test Worst 5 ก่อนหน้า				
NG Test No.				
1				
2				
3				
4				
5				

日付 DATE																																									
初期歩留まり (Initial Yield)																																									
カンバン (KANBAN)																																									
特技依頼 (Request TE)																																									
Worst 3	Test No. Worst. 1																																								
	Test No. Worst. 2																																								
	Test No. Worst. 3																																								
การแก้ไข (アクション)																																									
สาเหตุ (理由)																																									
Tester No.																																									
備考/リケツ交換等	今 Now																																								
จำนวนครั้งที่เปลี่ยน Socket ลงบนบอร์ด No.	1次 ครั้ง																																								
	2次 ครั้ง																																								
BIN16回数	M/C																																								
จำนวนครั้งที่ BIN16	Tester																																								
Pro.Ver																																									

O P 名	1S																																								
	2S																																								
GL																																									

<p>FT</p> <p>※ソケット点検結果記入要領</p> <p>①動作不良現象を Socket 行毎に記入する</p> <p>※ソケット毎の BIN167mm の回数を記入する 不良発生時に発生 Bin 16</p>	<p>アクション(対策)</p> <p>保→保全依頼 計→計測依頼 再→再セットアップ</p> <p>BIN→PM request T→TE request RE→RE-SETUP</p> <p>SO→ソケット交換 2→2次調査</p> <p>SO→change socket 2→2nd investigation</p>
<p>※通常は、2σで管理する</p> <p>FT process 行毎に不良発生数記入 2σ</p> <p>不良率の値、LCLを99%で管理する</p> <p>前bin new device 行毎に不良発生数記入 LCL 99%</p> <p>※前データ欄には前データの平均値を で記入</p>	<p>原因(診断)</p> <p>BIN→BOX テ→テスター 特→製品特性 セ→セットアップミス</p> <p>BIN→BOX TE→TESTER D→DEVICE ON LINE SE→SETUP MISS</p> <p>キ→機を調整バウク SO→ソケット交換</p> <p>M/C→M/C adjustment SO→Change socket</p>
<p>※不良発生数記入の記入要領は別添資料を参照してください</p>	

UCL	AVE	LCL (2σ)
%	%	%

規格公差範囲 (σ値の表示)

管理基準 (アゲンライズ) การจัดการ (การปรับปรุงแบบ)

- ① 実力値の 2σ を LCL とする (* 以前の LCL からは下らない)
การควบคุมแบบ 2σ คือการจัดการการต่ำกว่าเส้น LCL เท่านั้น..
(เช่นในเอกสารให้ต่ำกว่าค่า LCL ตาม..)
- ② 実力値の 0.4σ 以下は、廃止して、LCL を決める時集計から除外する
เมื่อ LCL ถูกตัดทิ้งไป, มีมากกว่า 4σ ของผลการสามารถจะอยู่ไกลเกินจากการคำนวณ.
- ③ 歩留り6連続上昇・下降
เมื่อค่า Yield เป็นระดับเดียวกันต่อเนื่อง 6 จุด (เหนือเส้น UCL หรือ ต่ำกว่า LCL)

管理周期 การควบคุมระยะเวลาการไถ่

① 確認周期・・・2回/LOT 管理ตรวจสอบสภาพ yield・・・2 ครั้ง / LOT
(1次・・・確認100cs 2次・・・中(終了時)確認1・・・100 単位毎検査การผลิต LOT นั้น ครั้งทั้ง 2・・・จบจน LOT)

② 管理基準変更周期・・・30LOT毎 ระยะเวลาเปลี่ยนแปลง Yield graph・・・ทุก 30 LOT

③ MAX3ヶ月 最新30日(インデックス)を直し・・・มากกว่าภายใน 3 เดือน ไม่ทำการพิจารณาในนอกๆ 30 日
(改善前より管理幅を拡大しない事) ห้ามไม่ให้ระยะเวลาการยึดเอาเป็นที่ยึดตาม